

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Физико-технический факультет

УТВЕРЖДЕНО:

Декан

Ю.Н. Рыжих

Рабочая программа дисциплины

Физические методы исследования композиционных материалов

по направлению подготовки

15.03.06 Мехатроника и робототехника

Направленность (профиль) подготовки:

Промышленная и специальная робототехника

Форма обучения

Очная

Квалификация

Инженер, инженер-разработчик

Год приема

2024

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОПОП

Е.И. Борзенко

Председатель УМК

В.А. Скрипняк

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК- 6 Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных, аргументировано защищать результаты выполненной работы

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ООПК-6.1 Знает основные методы и средства проведения экспериментальных исследований, способы обработки и представления данных, системы стандартизации и сертификации

ООПК-6.2 Умеет выбирать способы и средства измерений и проводить экспериментальные исследования

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить физические методы исследования материалов, понять принципы работы основных методов исследования материалов и сформировать алгоритмы проведения требуемых исследований для получения конкретной информации о структуре, строении и составе материалов, в зависимости от решаемых задач.

– Научиться применять реальные подходы отдельных методов исследования материалов для решения практических задач профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Пятый семестр, зачет

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования: Б1.О.06 Физика, Б1.О.14 Материаловедение и технология конструкционных материалов. Студент должен знать: основные термины, понятия, законы, принципы, методы указанных дисциплин.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часов, из которых:

-лекции: 28 ч.

-практические занятия: 14 ч.

в том числе практическая подготовка: 14 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Введение. Оптические методы исследования материалов.

Краткое содержание темы: Тема посвящена методам оптической микроскопии. Включает в себя рассмотрение таких понятий как строение вещества, строение твердых тел, масштабные уровни структуры, оптическая микроскопия, методы наблюдения (светлого поля, темного поля, в поляризованных лучах, фазового контраста, интерференционная микроскопия, дифференциальная интерференционно-контрастная микроскопия, оптическая металлография, конфокальная микроскопия).

Тема 2. Дифракционный анализ.

Краткое содержание темы: Рассматриваются такие понятия как интерференция и дифракция рентгеновского излучения, пучка электронов или нейтронов, непрерывный и характеристический рентгеновские спектры, преломление рентгеновских лучей, ослабление рентгеновского излучения при прохождении через материал и при дифракционном анализе, поглощение материалами рентгеновского излучения. Уделяется внимание вопросам выбора, фильтрации и монохроматизации излучения. Затрагиваются такие понятия кристаллографии как кристаллическая решетка, пространственная решетка, элементарная ячейка, ячейки Бравэ, а также принятые в кристаллографии и рентгеноструктурном анализе обозначения.

Тема 3. Анализ материалов методом дифракции рентгеновского излучения.

Краткое содержание темы: Рассматриваются рассеяние рентгеновских лучей отдельными атомами, условия Лауэ, формула Вульфа-Брэгга, разрешенные и запрещенные рефлексы, обратная решетка, построение Эвальда, интерференционная функция, факторы, влияющие на интенсивность вторичного луча.

Тема 4. Растровый электронный микроскоп.

Краткое содержание темы: Рассматривается устройство растрового электронного микроскопа, формирование пучка в микроскопе, фокусировка луча.

Тема 5. Регистрация сигналов и прикладная электронная микроскопия.

Краткое содержание темы: Затрагиваются вопросы, связанные с регистрацией сигнала при растровой электронной микроскопии, кратко характеризуются виды детекторов, используемых в микроскопии, уделяется внимание вопросам пробоподготовки.

Тема 6. Анализ материалов методом просвечивающей электронной микроскопии.

Краткое содержание темы: Кратко описывается устройство просвечивающего электронного микроскопа, рассматриваются способы пробоподготовки, характеризуются физические принципы, лежащие в основе методов ПЭМ.

Тема 7. Анализ материалов методами атомно-силовой микроскопии, Рамановской, Оже, рентгенофлуоресцентной и энергодисперсионной спектроскопии.

Краткое содержание темы: Рассматриваются методы атомно-силовой микроскопии, Рамановской, Оже, рентгенофлуоресцентной и энергодисперсионной спектроскопии. Затрагиваются вопросы пробоподготовки и интерпретации результатов, получаемых данными методами.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения устных опросов и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет в пятом семестре проводится в письменной форме. Продолжительность зачета 1 час.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «iDo» - <https://lms.tsu.ru/course/view.php?id=24738>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Растровая электронная микроскопия для нанотехнологий: методы и применение / [Роберт Андерхальт, Поль Анзалоне, П. Роберт Апкарриан и др.] ; под ред. Уэйли Жу и Жонг Лин Уанга ; пер. с англ. С. А. Иванова и К. И. Домкина ; под ред. Т. П. Каминской. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 582 с. – Режим доступа ЭБС Лань: https://e.lanbook.com/book/66212#book_name

- Попечителей Е. П. Технические методы диагностики биоматериалов: [учебное пособие] / Е. П. Попечителей. – Старый Оскол: ТНТ, 2014. – 315 с.

б) дополнительная литература:

- Кларк Эшли Р. Микроскопические методы исследования материалов: пер. с англ. / Э. Р. Кларк, К. Н. Эберхардт. — Москва: Техносфера, 2007. — 371 с.;

- Фульц Брент. Просвечивающая электронная микроскопия и дифрактометрия материалов: пер. с англ. / Б. Фульц, Дж. Хау. — Москва: Техносфера, 2011. — 904 с.: ил. — Мир физики и техники. — Библиогр.: с. 805-820.

- Современные методы исследования материалов и нанотехнологий: учебное пособие: (лабораторный практикум) / [М. А. Бубенчиков, Е. Э. Газиева, А. О. Гафуров и др.; под ред. В. И. Сырякина]. – Томск: Издательство Том. ун-та, 2010. – 365 с. – URL: <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000395423>

- Зевайль А. Трёхмерная электронная микроскопия в реальном времени / А. Зевайль, Дж. Томас; пер. с англ. А. В. Сухова. – Долгопрудный: Интеллект, 2013. – 327 с.

- Методы исследования материалов. Структура, свойства и процессы нанесения неорганических покрытий: учебное пособие / Л. И. Тушинский, А. В. Плохов, А. О. Токарев, В. И. Синдеев. — Москва: Мир, 2004. — 384 с.;

- Косенков Владимир Михайлович. Рентгенография в реакторном материаловедении / В. М. Косенков; Ульяновский государственный университет. — 2-е изд., перераб. и доп. — Ульяновск: Изд-во Ульяновского ГУ, 2006. — 168 с.: ил. — Библиогр.: с. 160-167.;

- Синдо Дайзукэ. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия: пер. с англ. / Д Синдо, Т. Оикава. — Москва: Техносфера, 2006. — 253 с.;

- Егорова Ольга Владимировна. Техническая микроскопия. Практика работы с микроскопами для технических целей / О. В. Егорова. — 2-е изд., перераб. — Москва: Техносфера, 2007. — 360 с.;

- Химич М.А. Физические методы исследования материалов: учебно-методическое пособие. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2023. – 128 с.

- Химич М.А. Введение в рентгеноструктурный анализ: учеб. пособие. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2022. – 88 с.

в) ресурсы сети Интернет:

– SpringerLink [Electronic resource] / Springer International Publishing AG, Part of Springer Science+Business Media. – Electronic data. – Cham, Switzerland, [s. n.]. – URL: <http://link.springer.com/> (Электронный ресурс SpringerLink: <http://link.springer.com/>);

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000- . – URL: <http://elibrary.ru/defaultx.asp?>;

- Электронная библиотека ТГУ: <http://www.lib.tsu.ru/ru>

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система. <http://www.consultant.ru>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.);

- программа Powder Cell (в открытом доступе).

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

в) профессиональные базы данных (*при наличии*):

– Учебные материалы по курсу кристаллохимия (в свободном доступе) – <http://www.chem.msu.su/rus/lab/phys/crychem/lectures/index.html>

– открытая база данных (в свободном доступе) – <http://www.crystallography.net/cod/>

– JP-Minerals (в свободном доступе) – <https://jp-minerals.org/en/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий практического типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Химич Маргарита Андреевна, к.т.н., Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, н.с./ Национальный исследовательский Томский государственный университет, Физико-технический факультет, доцент/ Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томский материаловедческий центр, инженер.